## 実験番号:202502104(2シフト)



# 硫化物固体電解質粒子表面の深さ分解解析

引間 和浩,岸 遼太,松葉 大志,松田 厚範 豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学系

キーワード:液相合成,表面状態,硫化物系固体電解質,全固体電池

# 1. 背景と研究目的

有機電解液を難燃性の固体電解質に置き換えた全固体リチウムイオン二次電池は、高い安全性、出力特性などの優れた特性を持つことから注目されている。全固体電池の実用化には、高イオン伝導性硫化物固体電解質の低コストかつ量産性に優れた合成法が求められている。液相法は低コストかつスケールアップが容易なため、有力な合成法の候補である。粒子の表面は、電池の固体電解質層として使う場合に粒界となり、電池特性に影響を与えることが予想される。そのため、液相合成した固体電解質粒子の表面状態を評価することが重要となるが、現時点では十分になされていない。そこで本課題では、入射X線エネルギーを変えてX線光電子分光(XPS)測定をして、液相合成した硫化物固体電解質の粒子表面の深さ分析を行うことを目的とした。本課題では硫化物系固体電解質としてLi<sub>10</sub>GeP<sub>2</sub>S<sub>12</sub>(LGPS)を選定した。

#### 2. 実験内容

## 3. 結果および考察

Fig.1 に、LGPS 固体電解質の XPS 測定結果を示す。入射 X 線のエネルギーを 650 eV で測定した C 1s スペクトルについて、MM 合成試料は 285 eV のみにピークを観測した一方で、溶液合成試料では 284 eV にもピークが見られた。さらに、入射 X 線のエネルギーを 380 eV に変更した場合、MM 合成試料では新たなピークは観測されなかったが、溶液合成試料では 286 eV, 287 eV 付近に新たなピークを観測した。284 eV 付近のピークは入射 X 線のエネルギーに関わらず観測されたことから、比較的厚い成分として存在している一方で、286 eV, 287 eV 付近の成分は最表面にのみ存在していることが推測された。以上の結果は、溶液法で合成した粒子上に、有機溶媒に起因する表面成分が複数存在することを示唆している。

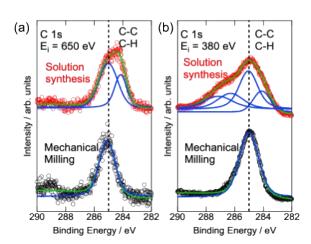


Fig. 1 C 1s XPS spectra of a  $\text{Li}_{10}\text{GeP}_2\text{S}_{12}$  solid electrolytes synthesized by solution synthesis and mechanical milling methods with (a) 650 eV, (b) 380 eV of incident X-rays.

4. 参考文献: 1. K. Hikima et. al., Chem. Commun., 59, 6564-6567 (2023).